

JIS C 5402-2-2:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第2-2部：導通及び接触抵抗試験—試験2b：接触抵抗—規定電流法……………	IEC 60512-2-2：2003(IDT)…	293
JIS C 5402-2-3:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第2-3部：導通及び接触抵抗試験—試験2c：接触抵抗の変動……………	IEC 60512-2-3：2002(IDT)…	295
JIS C 5402-2-5:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第2-5部：導通及び接触抵抗試験—試験2e：コンタクトディスターバンス……………	IEC 60512-2-5：2003(IDT)…	296
JIS C 5402-2-6:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第2-6部：導通及び接触抵抗試験—試験2f：ハウジング(シェル)の導通性……………	IEC 60512-2-6：2002(IDT)…	298
JIS C 5402-3-1:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第3-1部：絶縁試験—試験3a：絶縁抵抗……………	IEC 60512-3-1：2002(IDT)…	300
JIS C 5402-4-1:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第4-1部：電圧ストレス試験—試験4a：耐電圧……………	IEC 60512-4-1：2003(IDT)…	301
JIS C 5402-4-2:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第4-2部：電圧ストレス試験—試験4b：部分放電……………	IEC 60512-4-2：2002(IDT)…	303
JIS C 5402-4-3:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第4-3部：電圧ストレス試験—試験4c：耐電圧(絶縁被覆付クリンプバレル)……………	IEC 60512-4-3：2002(IDT)…	304
JIS C 5402-5-1:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第5-1部：電流量試験—試験5a：温度上昇……………	IEC 60512-5-1：2002(IDT)…	305
JIS C 5402-5-2:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第5-2部：電流量試験—試験5b：電流・温度の軽減……………	IEC 60512-5-2：2002(IDT)…	307
JIS C 5402-6-1:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第6-1部：動的ストレス試験—試験6a：加速度(定常)……………	IEC 60512-6-1：2002(IDT)…	310
JIS C 5402-6-2:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第6-2部：動的ストレス試験—試験6b：バンプ……………	IEC 60512-6-2：2002(IDT)…	312
JIS C 5402-6-3:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第6-3部：動的ストレス試験—試験6c：衝撃……………	IEC 60512-6-3：2002(IDT)…	314
JIS C 5402-6-4:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第6-4部：動的ストレス試験—試験6d：正弦波振動……………	IEC 60512-6-4：2002(IDT)…	316
JIS C 5402-7-1:2016	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第7-1部：衝撃試験(可動形コネクタ)—試験7a：自由落下(繰返し)……………	IEC 60512-7-1：2010(IDT)…	318
JIS C 5402-7-2:2019	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第7-2部：衝撃試験(可動形コネクタ)—試験7b：機械的衝撃強さ……………	IEC 60512-7-2：2011(IDT)…	321

JIS C 5402-8-1:2016	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第8-1部：静的な力試験(固定形コネクタ)—試験8a：静的な力，横方向……………	IEC 60512-8-1：2010(IDT)…	325
JIS C 5402-8-2:2016	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第8-2部：静的な力試験(固定形コネクタ)—試験8b：静的な力，軸方向……………	IEC 60512-8-2：2011(IDT)…	327
◇ JIS C 5402-8-3:2016	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第8-3部：静的な力試験(固定形コネクタ)—試験8c：操作レバーの強度……………	IEC 60512-8-3：2011(IDT)…	329
JIS C 5402-9-1:2016	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第9-1部：耐久試験—試験9a：機械的動作……………	IEC 60512-9-1：2010(IDT)…	332
JIS C 5402-9-2:2019	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第9-2部：耐久試験—試験9b：電氣的負荷及び温度……………	IEC 60512-9-2：2011(IDT)…	335
JIS C 5402-10-4:2006	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第10-4部：インパクト試験(可動形部品)，静的負荷試験(固定形部品)，耐久試験及び過負荷試験—試験10d：電氣的過負荷(コネクタ)……………	IEC 60512-10-4：2003(IDT)…	338
㊦ JIS C 5402-11-1:2022	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-1部：耐候性試験—試験11a：一連耐候性……………	IEC 60512-11-1：2019(MOD)…	341
JIS C 5402-11-2:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-2部：耐候性試験—試験11b：低温・減圧・湿度複合シーケンス……………	IEC 60512-11-2：2002(IDT)…	355
JIS C 5402-11-3:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-3部：耐候性試験—試験11c：高温高湿(定常)……………	IEC 60512-11-3：2002(IDT)…	357
JIS C 5402-11-4:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-4部：耐候性試験—試験11d：温度急変……………	IEC 60512-11-4：2002(IDT)…	359
JIS C 5402-11-5:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-5部：耐候性試験—試験11e：かびの成長……………	IEC 60512-11-5：2002(IDT)…	361
JIS C 5402-11-6:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-6部：耐候性試験—試験11f：腐食，塩水噴霧……………	IEC 60512-11-6：2002(IDT)…	363
JIS C 5402-11-7:2006	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-7部：耐候性試験—試験11g：混合ガス流腐食……………	IEC 60512-11-7：2003(IDT)…	365
JIS C 5402-11-8:2002	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-8部：耐候性試験—試験11h：砂じん……………	IEC 60512-11-8：1995(IDT)…	367
JIS C 5402-11-9:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-9部：耐候性試験—試験11i：高温……………	IEC 60512-11-9：2002(IDT)…	369
JIS C 5402-11-10:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-10部：耐候性試験—試験11j：低温……………	IEC 60512-11-10：2002(IDT)…	371
JIS C 5402-11-11:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-11部：耐候性試験—試験11k：減圧……………	IEC 60512-11-11：2002(IDT)…	373

JIS C 5402-11-12:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-12部: 耐候性試験—試験11m: 温湿度サイクル……………	……………IEC 60512-11-12: 2002(IDT) ……	375
JIS C 5402-11-13:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-13部: 耐候性試験—試験11n: ガスタイト・無はんだラッピング接続……………	……………IEC 60512-11-13: 2002(IDT) ……	377
JIS C 5402-11-14:2006	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-14部: 耐候性試験—試験11p: 単一ガス流腐食……………	……………IEC 60512-11-14: 2003(IDT) ……	379
JIS C 5402-12-1:2016	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-1部: はんだ付け試験—試験12a: はんだ付け性, むれ(ウェットティング), はんだ槽法……………	……………IEC 60512-12-1: 2006(MOD) ……	382
JIS C 5402-12-2:2016	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-2部: はんだ付け試験—試験12b: はんだ付け性, むれ(ウェットティング), はんだこて法 ……	……………IEC 60512-12-2: 2006(MOD) ……	387
JIS C 5402-12-4:2016	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-4部: はんだ付け試験—試験12d: はんだ耐熱性, はんだ槽法……………	……………IEC 60512-12-4: 2006(MOD) ……	392
JIS C 5402-12-5:2016	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-5部: はんだ付け試験—試験12e: はんだ耐熱性, はんだこて法……………	……………IEC 60512-12-5: 2006(MOD) ……	397
JIS C 5402-12-6:2002	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-6部: はんだ付け試験—試験12f: 自動はんだ付けにおけるフラックス及び洗浄液に対する封止……………	……………IEC 60512-12-6: 1996(IDT) ……	400
JIS C 5402-12-7:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-7部: はんだ付け試験—試験12g: はんだ付け性, 平衡法……………	……………IEC 60512-12-7: 2001(IDT) ……	403
JIS C 5402-13-1:2015	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第13-1部: 機械的動作試験—試験13a: 結合力及び離脱力……………	……………IEC 60512-13-1: 2006(IDT) ……	405
JIS C 5402-13-2:2012	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第13-2部: 機械的動作試験—試験13b: 挿入力及び引抜き力……………	……………IEC 60512-13-2: 2006(IDT) ……	407
JIS C 5402-13-5:2014	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第13-5部: 機械的動作試験—試験13e: 極性及びキーイング……………	……………IEC 60512-13-5: 2006(IDT) ……	409
JIS C 5402-14-2:2016	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第14-2部: 封止(気密性)試験—試験14b: 封止(気密性)—微小エアリーク……………	……………IEC 60512-14-2: 2006(IDT) ……	412
JIS C 5402-14-4:2016	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第14-4部: 封止(気密性)試験—試験14d: 浸せき—防水……………	……………IEC 60512-14-4: 2006(IDT) ……	415

JIS C 5402-14-5:2016	電子機器用コネクタ試験及び測定—第14-5部:封止(気密性)試験—試験14e:浸せき(減圧) ……IEC 60512-14-5:2006(IDT)…	418
JIS C 5402-14-6:2016	電子機器用コネクタ試験及び測定—第14-6部:封止(気密性)試験—試験14f:インタフェーシャルシーリング …… …IEC 60512-14-6:2006(IDT)…	421
JIS C 5402-14-7:2002	電子機器用コネクタ試験及び測定—第14-7部:封止(気密性)試験—試験14g:噴射水 ……IEC 60512-14-7:1997(IDT)…	424
JIS C 5402-15-1:2014	電子機器用コネクタ試験及び測定—第15-1部:コネクタ試験(機械的試験)—試験15a:インサート内のコンタクト保持 …… …IEC 60512-15-1:2008(IDT)…	426
JIS C 5402-15-2:2014	電子機器用コネクタ試験及び測定—第15-2部:コネクタ試験(機械的試験)—試験15b:ハウジング内のインサート保持(軸方向) …… …IEC 60512-15-2:2008(MOD)…	429
JIS C 5402-15-3:2014	電子機器用コネクタ試験及び測定—第15-3部:コネクタ試験(機械的試験)—試験15c:ハウジング内のインサート保持(ねじれ方向) …… …IEC 60512-15-3:2008(IDT)…	433
JIS C 5402-15-4:2014	電子機器用コネクタ試験及び測定—第15-4部:コネクタ試験(機械的試験)—試験15d:コンタクトの挿入,解放及び引抜力 …… …IEC 60512-15-4:2008(IDT)…	436
JIS C 5402-15-5:2014	電子機器用コネクタ試験及び測定—第15-5部:コネクタ試験(機械的試験)—試験15e:インサート内のコンタクト保持,ケーブルの回転(nutation) …… …IEC 60512-15-5:2008(IDT)…	439
JIS C 5402-15-6:2014	電子機器用コネクタ試験及び測定—第15-6部:コネクタ試験(機械的試験)—試験15f:コネクタカップリング機構の効果 …… …IEC 60512-15-6:2008(IDT)…	442
JIS C 5402-15-8:2002	電子機器用コネクタ試験及び測定—第15-8部:コネクタ試験(機械的試験)—試験15h:コンタクト保持機構,工具の使用に対する耐久性 …… …IEC 60512-15-8:1995(IDT)…	444
JIS C 5402-16-1:2014	電子機器用コネクタ試験及び測定—第16-1部:コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16a:プローブダメージ …… …IEC 60512-16-1:2008(IDT)…	446
JIS C 5402-16-2:2012	電子機器用コネクタ試験及び測定—第16-2部:コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16b:リストラクテッドエントリ …… …IEC 60512-16-2:2008(IDT)…	449
JIS C 5402-16-3:2014	電子機器用コネクタ試験及び測定—第16-3部:コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16c:コンタクト曲げ強度 …… …IEC 60512-16-3:2008(IDT)…	451
JIS C 5402-16-4:2012	電子機器用コネクタ試験及び測定—第16-4部:コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16d:引張強度(圧着接続) …… …IEC 60512-16-4:2008(IDT)…	454

JIS C 5402-16-5:2012	電子機器用コネクタ試験及び測定—第16-5部:コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16e:ゲージ保持力(弾性コンタクト)……………	IEC 60512-16-5:2008(IDT)…	456
JIS C 5402-16-6:2014	電子機器用コネクタ試験及び測定—第16-6部:コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16f:ターミネーション強度……………	IEC 60512-16-6:2008(IDT)…	458
JIS C 5402-16-7:2012	電子機器用コネクタ試験及び測定—第16-7部:コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16g:圧着後のコンタクトの変形測定……………	IEC 60512-16-7:2008(IDT)…	460
JIS C 5402-16-8:2015	電子機器用コネクタ試験及び測定—第16-8部:コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16h:インシュレーショングリップの有効性(圧着接続)……………	IEC 60512-16-8:2008(IDT)…	463
JIS C 5402-16-9:2015	電子機器用コネクタ試験及び測定—第16-9部:コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16i:接地コンタクトスプリングの保持力……………	IEC 60512-16-9:2008(IDT)…	466
JIS C 5402-16-13:2015	電子機器用コネクタ試験及び測定—第16-13部:コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16m:ラッピングの巻き戻し, 無はんだラッピング接続……………	IEC 60512-16-13:2008(IDT)…	468
JIS C 5402-16-20:2002	電子機器用コネクタ試験及び測定—第16-20部:コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16t:機械的強度(無はんだ接続のターミネーション)……………	IEC 60512-16-20:1996(IDT)…	470
JIS C 5402-17-1:2015	電子機器用コネクタ試験及び測定—第17-1部:ケーブルクランプ試験—試験17a:ケーブルクランプ強度……………	IEC 60512-17-1:2010(IDT)…	471
JIS C 5402-17-2:2015	電子機器用コネクタ試験及び測定—第17-2部:ケーブルクランプ試験—試験17b:ケーブルクランプ強度(ケーブルの回転)……………	IEC 60512-17-2:2011(IDT)…	473
JIS C 5402-17-3:2018	電子機器用コネクタ試験及び測定—第17-3部:ケーブルクランプ試験—試験17c:ケーブルクランプ強度(ケーブルの引張り)……………	IEC 60512-17-3:2010(IDT)…	475
JIS C 5402-17-4:2015	電子機器用コネクタ試験及び測定—第17-4部:ケーブルクランプ試験—試験17d:ケーブルクランプ強度(ケーブルのねじり)……………	IEC 60512-17-4:2010(IDT)…	477
JIS C 5402-19-3:2002	電子機器用コネクタ試験及び測定—第19-3部:耐化学薬品試験—試験19c:耐液性……………	IEC 60512-19-3:1997(IDT)…	479
JIS C 5402-20-2:2005	電子機器用コネクタ試験及び測定—第20-2部:耐火性試験—試験20b:耐火性……………	IEC 60512-20-2:2000(IDT)…	482
JIS C 5402-22-1:2016	電子機器用コネクタ試験及び測定—第22-1部:静電容量試験—試験22a:静電容量……………	IEC 60512-22-1:2010(IDT)…	487

JIS C 5402-23-3:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第23-3部：スクリーニング及びフィルタリング試験—試験23c：コネクタ及びアクセサリのシールド効果……………	IEC 60512-23-3：2000(IDT)…	489
JIS C 5402-23-4:2006	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第23-4部：スクリーニング及びフィルタリング試験—試験23d：時間領域での伝送線の反射……………	IEC 60512-23-4：2001(IDT)…	495
JIS C 5432:1994	電子機器用丸形R01コネクタ……………		501
⑨ JIS C 5410-1:2021	高周波同軸コネクタ—第1部：品目別通則—一般要求事項及び測定方法……………	IEC 61169-1：2013(MOD)…	516
JIS C 5411:1995	高周波同軸C01形コネクタ……………		570
JIS C 5412:1995	高周波同軸C02形コネクタ……………		586
JIS C 5413:1995	高周波同軸C03形コネクタ……………		603
JIS C 5414:1995	高周波同軸C04形コネクタ……………		620
JIS C 5415:1995	高周波同軸C05形コネクタ……………		634
JIS C 5419:1995	高周波同軸C11形コネクタ……………		644
JIS C 5442:1996	制御用小形電磁リレーの試験方法……………		653
⑩ JIS C 5445:2021	電子機器用スイッチ—第1部：通則……………	IEC 61020-1：2019(MOD)…	692
JIS C 6560:1994	単頭プラグ・ジャック……………		773
JIS C 6571:2015	電子機器用トグルスイッチ……………		786
JIS C 62246-1:2016	リードスイッチ—第1部：品目別通則……………	IEC 62246-1：2015(IDT)…	849
JIS C 62246-1-1:2016	リードスイッチ—第1-1部：品質評価及び試験方法……………	IEC 62246-1-1：2013(MOD)…	904

電気・電子機器用機械的構造

JIS C 6012-3-100:2015	電子機器用の機械的構造—482.6 mm (19 in) シリーズの機械的構造寸法—フロントパネル、サブラック、シャシ、ラック及びキャビネットの基本寸法……………	IEC 60297-3-100：2008(IDT)…	945
⑨ JIS C 62610-2:2021	電気及び電子装置用の機械的構造—屋内キャビネットの熱管理—第2部：強制空冷構造の決定方法……………	IEC 62610-2：2018(IDT)…	956
⑨ JIS C 62610-5:2021	電気及び電子装置用の機械的構造—屋内キャビネットの熱管理—第5部：屋内キャビネットの冷却性能……………	IEC 62610-5：2016(IDT)…	969
⑨ JIS C 62610-6:2021	電気及び電子装置用の機械的構造—屋内キャビネットの熱管理—第6部：屋内キャビネットのエア再循環及びバイパス……………	IEC 62610-6：2020(IDT)…	983

プリント配線板

JIS C 5010:1994	プリント配線板通則……………		1003
-----------------	----------------	--	------

JIS C 5012:1993	プリント配線板試験方法	1012
	……………IEC 60326-2:1990, -4~6:1980(MOD) ……	
JIS C 5013:1996	片面及び両面プリント配線板	1030
JIS C 5014:1994	多層プリント配線板	1047
JIS C 5016:1994	フレキシブルプリント配線板試験方法	1066
	……………IEC 60249-1:1982, 60326-2:1990(MOD) ……	
JIS C 5017:1994	フレキシブルプリント配線板—片面・両面	1081
	……………IEC 60326-7, -8:1981(MOD) ……	
⑨ JIS C 5018:2023	フレキシブルプリント配線板の折り畳み試験方法(解説収録)	1087
JIS C 5603:1993	プリント回路用語	1099
JIS C 6471:1995	フレキシブルプリント配線板用銅張積層板試験方法	1116
	……………IEC 60249-1:1982(MOD) ……	
JIS C 6472:1995	フレキシブルプリント配線板用銅張積層板—ポリエステルフィルム, ポリイ ミドフィルム	1131
JIS C 6480:1994	プリント配線板用銅張積層板通則	1137
JIS C 6481:1996	プリント配線板用銅張積層板試験方法	1140
	……………IEC 60249-1:1982, Amd.1:1984(MOD) ……	
JIS C 6482:1997	プリント配線板用銅張積層板—紙基材エポキシ樹脂	1163
	……………IEC 60249-2-3:1987(MOD) ……	
JIS C 6483:1997	プリント配線板用銅張積層板—合成繊維布基材エポキシ樹脂	1168
JIS C 6484:2005	プリント配線板用銅張積層板—耐燃性ガラス布基材エポキシ樹脂	1173
	……………IEC 61249-2-7:2002, -2-8:2003(MOD) ……	
JIS C 6485:2008	プリント配線板用銅張積層板—紙基材フェノール樹脂	1187
	……………IEC 61249-2-1, -2-2:2005(MOD) ……	
JIS C 6488:1999	プリント配線板用銅張積層板—耐燃性ガラス布・紙複合基材エポキシ樹脂 銅張積層板	1198
	……………IEC 60249-2-9:1987(MOD) ……	
JIS C 6489:1999	プリント配線板用銅張積層板—耐燃性ガラス布・ガラス不織布複合基材エ ポキシ樹脂銅張積層板	1205
	……………IEC 60249-2-10:1987(MOD) ……	
JIS C 6490:1998	プリント配線板用銅張積層板—耐燃性ガラス布基材ポリアミド樹脂	1211
	……………IEC 60249-2-16:1992, Amd.1:1993, Amd.2:1994(MOD) ……	
JIS C 6492:1998	プリント配線板用銅張積層板—耐燃性ガラス布基材ビスマレイミドトリアジ ン・エポキシ樹脂	1218
	……………IEC 60249-2-18:1992, Amd.1:1993, Amd.2:1994(MOD) ……	
JIS C 6493:1999	多層プリント配線板用銅張積層板—耐燃性ガラス布基材ポリアミド樹脂銅 張積層板	1225
	……………IEC 60249-2-17:1992(MOD) ……	
JIS C 6494:1999	多層プリント配線板用銅張積層板—耐燃性ガラス布基材ビスマレイミド/ト リアジン/エポキシ樹脂銅張積層板	1231
	……………IEC 60249-2-19:1992(MOD) ……	
JIS C 6515:1998	プリント配線板用銅はく	1237
	……………IEC 61249-5-1:1995(IDT) ……	
JIS C 6520:1993	多層プリント配線板用プリプレグ通則	1246

JIS C 6521:1996	多層プリント配線板用プリプレグ試験方法	……………	……………IEC 60249-3-1:1981(MOD)…	1248
JIS C 6522:1996	多層プリント配線板用プリプレグーガラス布基材エポキシ樹脂	……………	……………IEC 60249-3-1:1981(MOD)…	1255
JIS C 6523:1995	多層プリント配線板用プリプレグーガラス布基材ポリイミド樹脂	……………		1258
JIS C 6524:1995	多層プリント配線板用プリプレグーガラス布基材ビスマレイミド/トリアジン /エポキシ樹脂	……………		1261

実装技術

JIS C 61188-7:2020	プリント配線板及びプリント配線板実装—設計及び使用—第7部:CAD ライブラリに用いる電子部品の基準点及び配置方向	……………	……………IEC 61188-7:2017(IDT)…	1267
Ⓢ JIS C 61191-1:2021	プリント配線板実装—第1部:通則—表面実装及び関連する実装技術 を用いた電気機器・電子機器用はんだ付け実装要求事項	……………	……………IEC 61191-1:2018(IDT)…	1283
JIS C 61191-2:2020	プリント配線板実装—第2部:部門規格—表面実装はんだ付け要求事 項	……………	……………IEC 61191-2:2017(IDT)…	1317
JIS C 61191-3:2020	プリント配線板実装—第3部:部門規格—挿入実装はんだ付け要求事 項	……………	……………IEC 61191-3:2017(IDT)…	1345
JIS C 61191-4:2020	プリント配線板実装—第4部:部門規格—端子実装はんだ付け要求事 項	……………	……………IEC 61191-4:2017(IDT)…	1359
JIS C 61191-6:2011	プリント配線板実装—第6部: BGA及びLGAのはんだ接合部のボイド 評価基準及び測定方法	……………	……………IEC 61191-6:2010(IDT)…	1373
JIS C 62137-1-1:2010	表面実装技術—はんだ接合部耐久性試験方法—第1-1部:引きは がし強度試験方法	……………	……………IEC 62137-1-1:2007(IDT)…	1395
JIS C 62137-1-2:2010	表面実装技術—はんだ接合部耐久性試験方法—第1-2部:横押し せん断強度試験方法	……………	……………IEC 62137-1-2:2007(IDT)…	1403
JIS C 62137-1-3:2011	表面実装技術—はんだ接合部耐久性試験方法—第1-3部:繰返し 落下試験方法	……………	……………IEC 62137-1-3:2008(IDT)…	1413
JIS C 62137-1-4:2011	表面実装技術—はんだ接合部耐久性試験方法—第1-4部:繰返し 曲げ試験方法	……………	……………IEC 62137-1-4:2009(IDT)…	1426
JIS C 62137-1-5:2011	表面実装技術—はんだ接合部耐久性試験方法—第1-5部:せん断 疲労試験方法	……………	……………IEC 62137-1-5:2009(IDT)…	1433
JIS C 62137-3:2014	電子実装技術—第3部: はんだ接合部耐久性試験方法の選定指針	……………	……………IEC 62137-3:2011(IDT)…	1443
JIS C 62137-4:2016	電子実装技術—第4部: エリアレイ形表面実装部品のはんだ接合部 耐久性試験方法	……………	……………IEC 62137-4:2014(IDT)…	1480

JIS C 62739-1:2015	溶融鉛フリーはんだを用いたウェーブソルダリング装置の侵食試験方法 —第1部：表面処理を施さない金属材料の侵食試験方法……………	IEC 62739-1:2013(IDT)… 1514
JIS C 62739-2:2019	溶融鉛フリーはんだを用いたウェーブソルダリング装置の侵食試験方法 —第2部：表面処理を施した金属材料の侵食試験方法……………	IEC 62739-2:2016(IDT)… 1526
JIS C 62739-3:2019	溶融鉛フリーはんだを用いたウェーブソルダリング装置の侵食試験方法 —第3部：試験方法の選定指針……………	IEC 62739-3:2017(IDT)… 1536

水晶振動子

㊦ JIS C 6701:2021	水晶振動子の通則及び試験方法……………	IEC 60122-1:2002, Amd.1:2017(MOD)… 1561
㊦ JIS C 6703:2021	水晶フィルタの通則及び試験方法……………	IEC 60368-1:2000, Amd.1:2004(MOD)… 1610
JIS C 6704:2017	人工水晶……………	IEC 60758:2016(MOD)… 1641
㊦ JIS C 6710:2021	発振器の通則及び試験方法……………	IEC 60679-1, 62884-1, -2:2017, -3:2018, -4:2019(MOD)… 1687

半 導 体

JIS C 7030:1993	トランジスタ測定方法……………	1785
JIS C 7031:1993	小信号用半導体ダイオード測定方法……………	IEC 60747-3:1985(MOD)… 1841

参 考

電子関係団体一覧……………	1863
JISの“まえがき”の省略……………	1867
ISO, IECが発行する規格・出版物の著作権……………	1868
主なSI単位への換算率表……………	1870